

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分
 【発行日】平成 19 年 5 月 10 日 (2007.5.10)

【公開番号】特開 2006-3227 (P2006-3227A)
 【公開日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)
 【年通号数】公開・登録公報 2006-001
 【出願番号】特願 2004-180023 (P2004-180023)
 【国際特許分類】

G 0 1 R 31/28 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 31/28 H

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 3 月 15 日 (2007.3.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被試験対象を試験する I C テスタにおいて、

設定値または変数が定義される設定値データの実行順が示される実行順データに基づいて、実行命令及び変数の設定値を出力するテストシステムコントローラと、

前記設定値データと前記実行順データに基づいて、設定値データの設定準備を行い、前記テストシステムコントローラからの実行命令及び変数の設定値により、設定値の設定を行い、前記被試験対象と信号の授受を 1 ピン以上行える複数のピンエレクトロニクスカードと

を備えたことを特徴とする I C テスタ。

【請求項 2】

テストシステムコントローラは、

少なくとも実行順データ、変数の設定値を記憶する第 1 の記憶部と、

この記憶部の実行順データ、変数の設定値に基づいて、実行命令及び設定の変数値を出力する第 1 の制御部と

を有し、

ピンエレクトロニクスカードは、

設定データ、実行順データを記憶する第 2 の記憶部と、

この第 2 の記憶部の実行順データに基づいて、第 2 の記憶部の設定データを準備し、前記第 1 の制御部の実行命令及び変数の設定値により、設定値を設定する第 2 の制御部とを設けたことを特徴とする請求項 1 記載の I C テスタ。

【請求項 3】

ピンエレクトロニクスカードは、テストシステムコントローラから変数の設定値を受け取り、設定データの変数を固定値にすることを特徴とする請求項 1 または 2 記載の I C テスタ。

【請求項 4】

ピンエレクトロニクスカードは、所望の変数のみ固定値にすることを特徴とする請求項 3 記載の I C テスタ。

【請求項 5】

被試験対象を試験する I C テスタにおいて、

実行命令を出力するテストシステムコントローラと、
設定値が定義される設定値データとこの設定データの実行順が示される実行順データとに基づいて、設定値データの設定準備を行い、前記テストシステムコントローラからの実行命令により、設定値の設定を行い、前記被試験対象と信号の授受を1ピン以上行える複数のピンエレクトロニクスカードとを備えたことを特徴とするICテスト。

【請求項6】

テストシステムコントローラは、
少なくとも実行順データを記憶する第1の記憶部と、
この記憶部の実行順データに基づいて、実行命令を出力する第1の制御部とを有し、
ピンエレクトロニクスカードは、
設定データ、実行順データを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部の実行順データに基づいて、第2の記憶部の設定データを準備し、前記第1の制御部の実行命令により、設定値を設定する第2の制御部とを設けたことを特徴とする請求項5記載のICテスト。

【請求項7】

被試験対象を試験するICテストにおいて、
実行命令を出力するテストシステムコントローラと、
設定値が定義される設定データ、この設定データの実行順が示される実行順データを記憶する複数の記憶部と、
この記憶部の実行順データに基づいて、記憶部の設定データを準備し、前記テストシステムコントローラの実行命令により、設定値を設定する複数の制御部とを設けたことを特徴とするICテスト。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

このような課題を達成するために、本発明のうち請求項1記載の発明は、
被試験対象を試験するICテストにおいて、
設定値または変数が定義される設定値データの実行順が示される実行順データに基づいて、実行命令及び変数の設定値を出力するテストシステムコントローラと、
前記設定値データと前記実行順データに基づいて、設定値データの設定準備を行い、前記テストシステムコントローラからの実行命令及び変数の設定値により、設定値の設定を行い、前記被試験対象と信号の授受を1ピン以上行える複数のピンエレクトロニクスカードとを備えたことを特徴とするものである。

請求項2記載の発明は、請求項1記載の発明において、
テストシステムコントローラは、
少なくとも実行順データ、変数の設定値を記憶する第1の記憶部と、
この記憶部の実行順データ、変数の設定値に基づいて、実行命令及び設定の変数値を出力する第1の制御部とを有し、

ピンエレクトロニクスカードは、
設定データ、実行順データを記憶する第2の記憶部と、
この第2の記憶部の実行順データに基づいて、第2の記憶部の設定データを準備し、前記第1の制御部の実行命令及び変数の設定値により、設定値を設定する第2の制御部とを設けたことを特徴とするものである。

請求項 3 記載の発明は、請求項 1 または 2 記載の発明において、
ピンエレクトロニクスカードは、テストシステムコントローラから変数の設定値を受け取り、設定データの変数を固定値にすることを特徴とするものである。

請求項 4 記載の発明は、請求項 3 記載の発明において、
ピンエレクトロニクスカードは、所望の変数のみ固定値にすることを特徴とするものである。

請求項 5 記載の発明は、
被試験対象を試験する IC テスタにおいて、
実行命令を出力するテストシステムコントローラと、
設定値が定義される設定値データとこの設定データの実行順が示される実行順データとに基づいて、設定値データの設定準備を行い、前記テストシステムコントローラからの実行命令により、設定値の設定を行い、前記被試験対象と信号の授受を 1 ピン以上行える複数のピンエレクトロニクスカードと
を備えたことを特徴とするものである。

請求項 6 記載の発明は、請求項 5 記載の発明において、
テストシステムコントローラは、
少なくとも実行順データを記憶する第 1 の記憶部と、
この記憶部の実行順データに基づいて、実行命令を出力する第 1 の制御部と
を有し、
ピンエレクトロニクスカードは、
設定データ、実行順データを記憶する第 2 の記憶部と、
この第 2 の記憶部の実行順データに基づいて、第 2 の記憶部の設定データを準備し、前記第 1 の制御部の実行命令により、設定値を設定する第 2 の制御部と
を設けたことを特徴とするものである。

請求項 7 記載の発明は、
被試験対象を試験する IC テスタにおいて、
実行命令を出力するテストシステムコントローラと、
設定値が定義される設定データ、この設定データの実行順が示される実行順データを記憶する複数の記憶部と、
この記憶部の実行順データに基づいて、記憶部の設定データを準備し、前記テストシステムコントローラの実行命令により、設定値を設定する複数の制御部と
を設けたことを特徴とするものである。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

請求項 1, 2, 5, 6 によれば、ピンエレクトロニクスカードが、事前に設定データを格納し、設定準備を行うので、その都度、テストシステムコントローラが設定値を送る必要がなくなり、試験時間を短縮することができる。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

請求項 3, 4 によれば、ピンエレクトロニクスカードが変数を固定値と同じように扱うので、その都度、テストシステムコントローラがピンエレクトロニクスカードに変数の設定値を送る必要がなく、試験時間を短縮することができる。

請求項 7 によれば、記憶部が事前に設定データを格納し、制御部が設定準備を行うので、その都度、テストシステムコントローラが設定値を送る必要がなくなり、試験時間を短縮することができる。